



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15653—1995

---

## 金属氧化物半导体气敏元件测试方法

Measuring methods for gas sensors of metal-oxide semiconductor

1995-07-24 发布

1996-04-01 实施

---

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
金属氧化物半导体气敏元件测试方法  
GB/T 15653--1995

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.bzcbs.com>

电话：63787337、63787447

1996年8月第一版 2005年1月电子版制作

\*

书号：155066·1-12431

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

# 金属氧化物半导体气敏元件测试方法

Measuring methods for gas sensors of metal-oxide semiconductor

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了金属氧化物半导体气敏元件(以下简称元件)性能参数测试方法的基本原理,没有规定这些方法在实际使用时的技术细节,测试时可按相应的详细规范的规定进行。

本标准适用于金属氧化物半导体气敏元件性能参数的测试,其他气敏元件亦可参照使用。

## 2 引用标准

GB 2421 电工电子产品基本环境试验规则 总则

GB 3095 大气环境质量标准

GB 4475 敏感元器件术语

## 3 术语、符号

### 3.1 术语

本标准中所用术语应按 GB 4475 的规定。

### 3.2 符号

本标准的参数符号应按本标准附录 A(补充件)的规定。

## 4 一般要求

### 4.1 测试箱

- a. 测试箱的箱体材料应选择不与检测气体反应的材料;
- b. 箱体容积应保证其中每只元件平均占有容积不小于 1 L;
- c. 箱内应设有液体汽化装置、温湿度显示装置和气体搅拌装置。

### 4.2 测试气氛

清洁空气的要求应符合 GB 3095 中规定的 2 级环境空气标准。

采用标定气体检测时,其浓度容许误差应符合表 1 的规定。